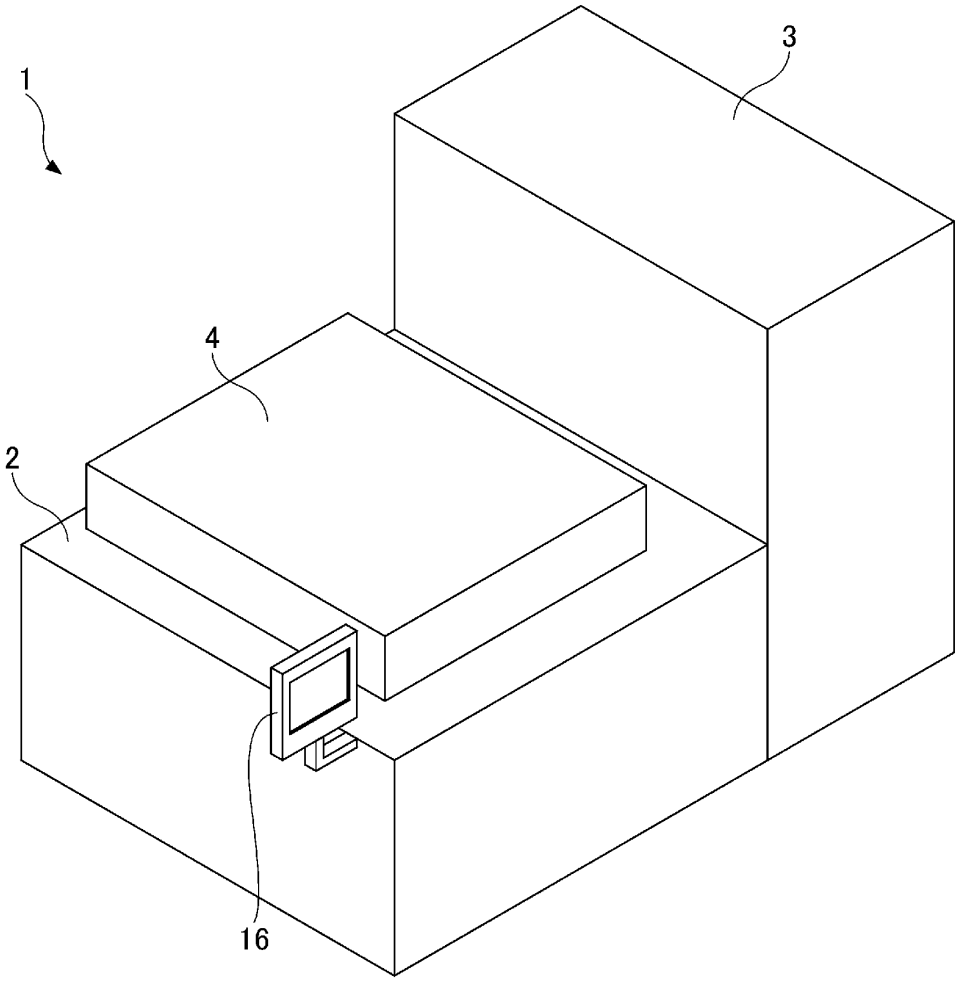
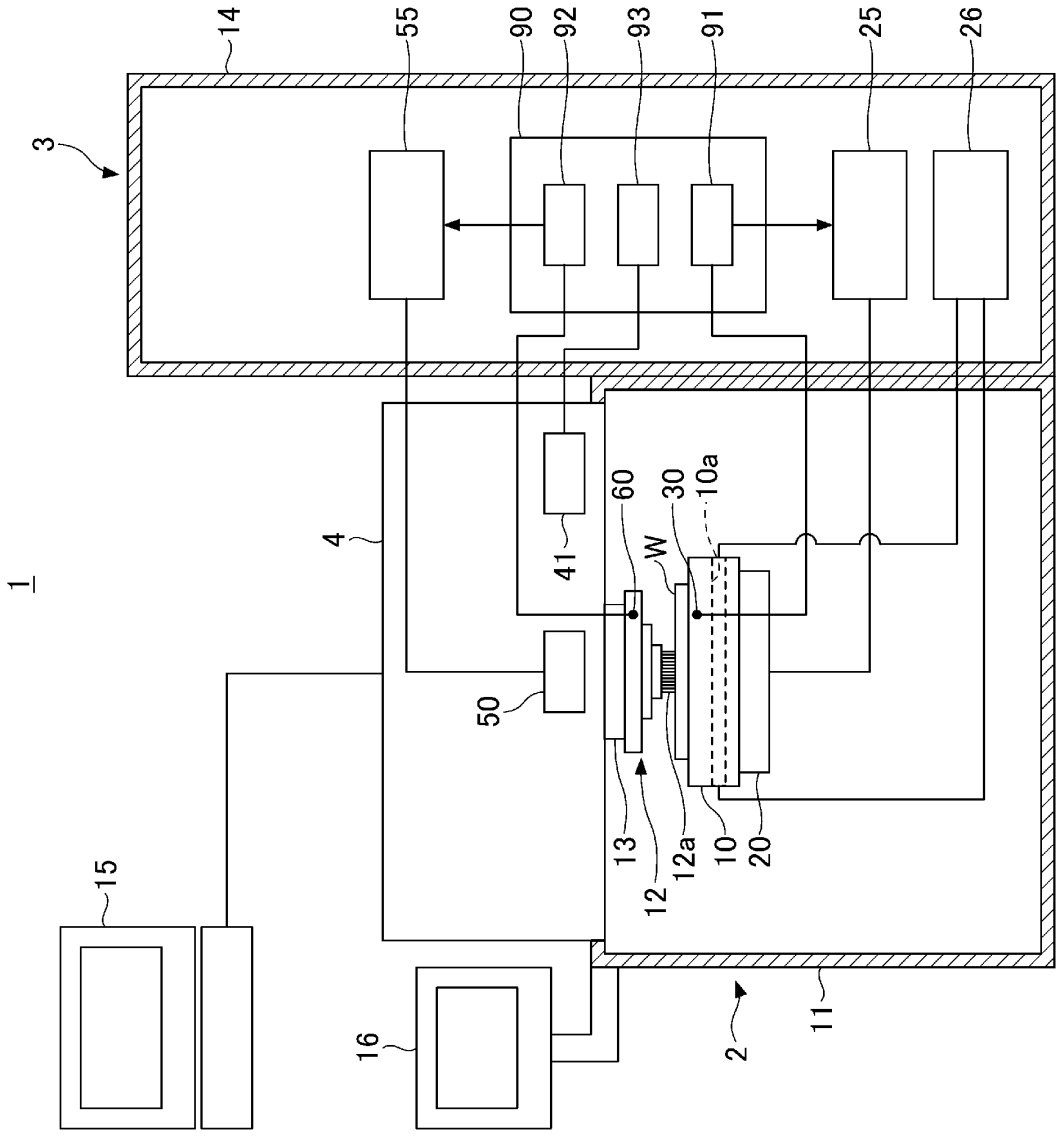
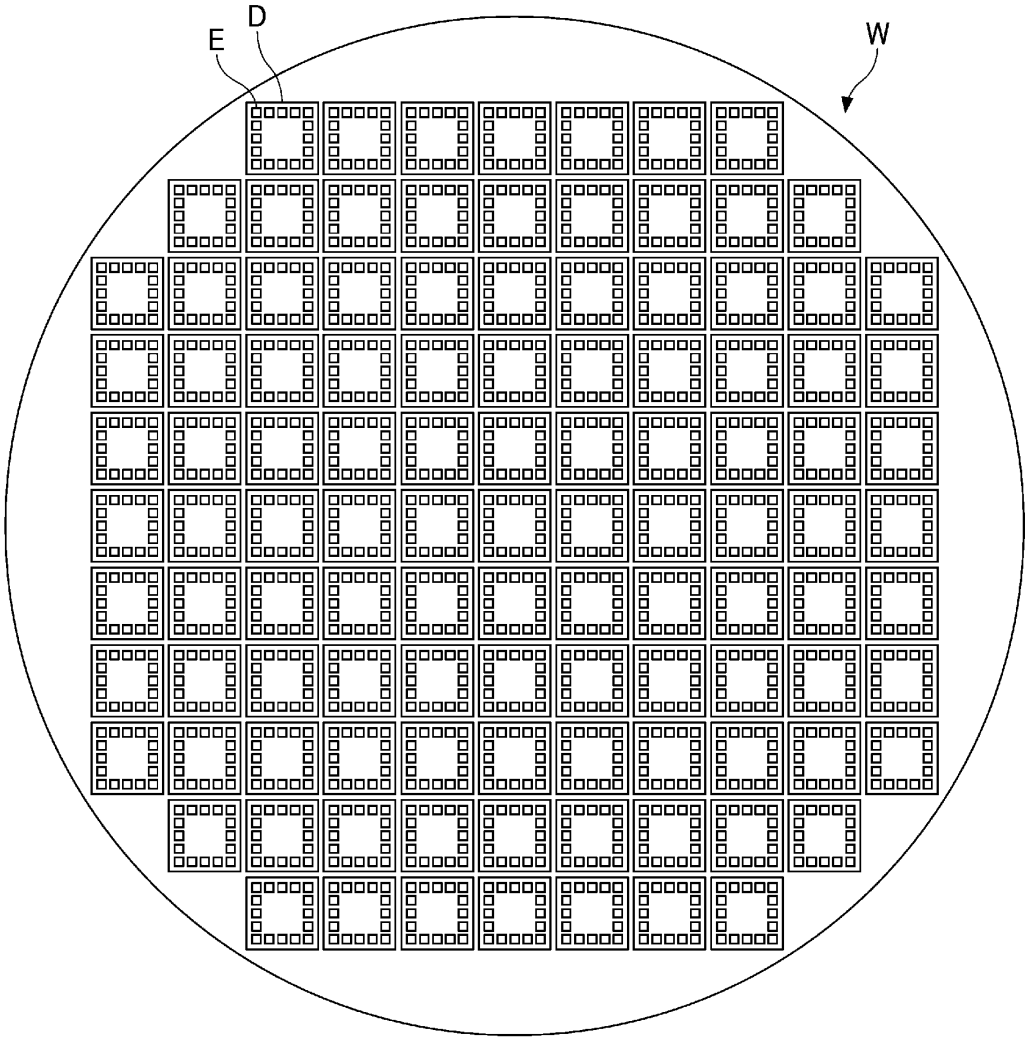
[図1]



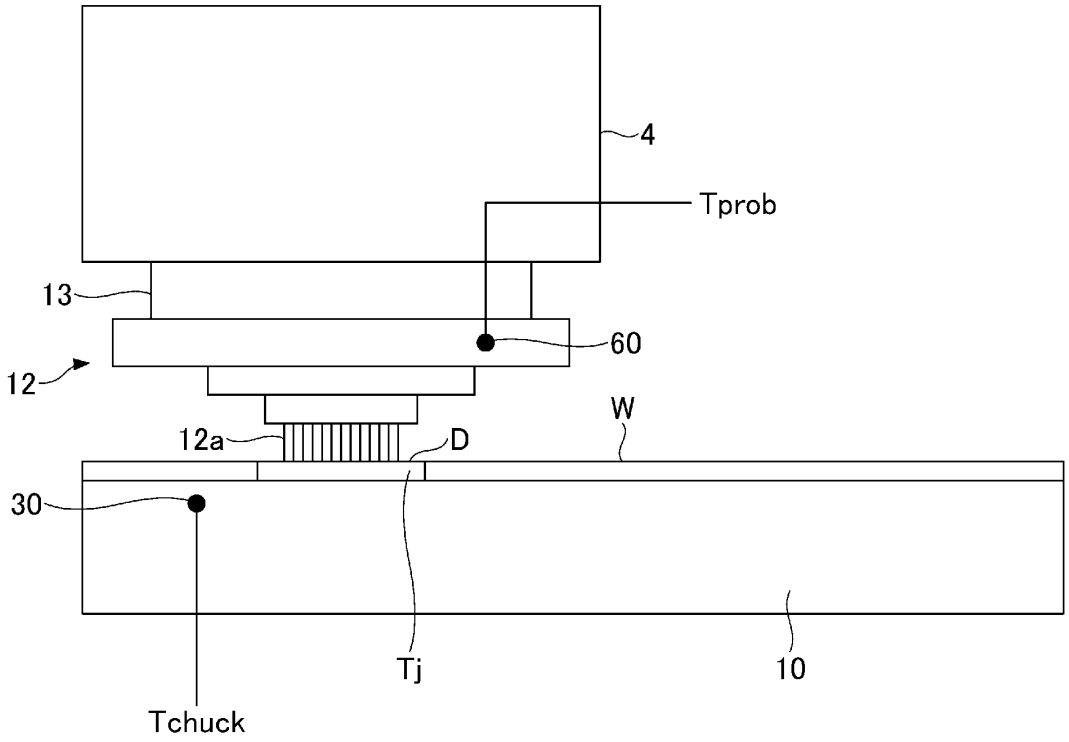
[図2]



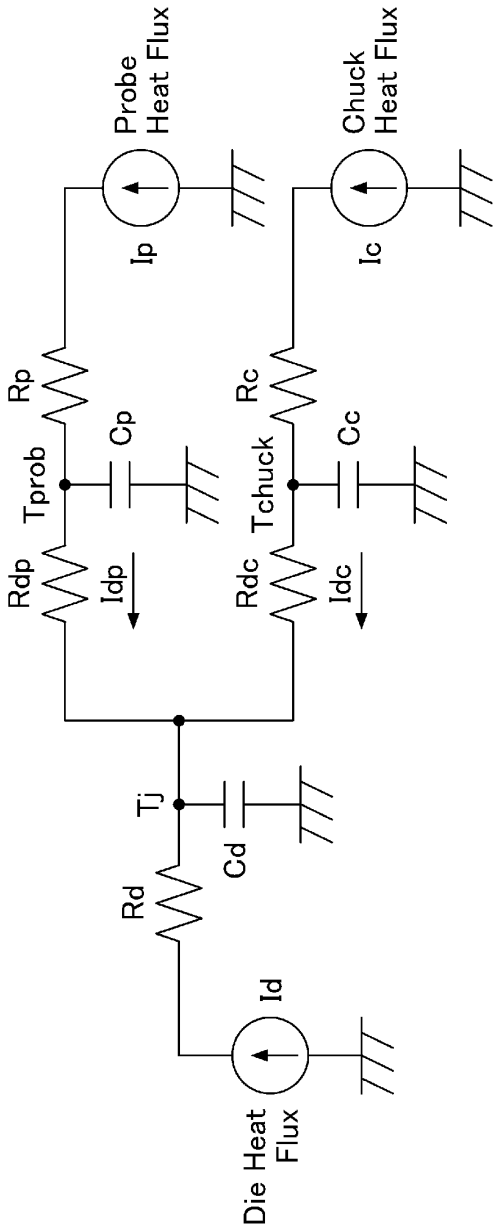
[図3]



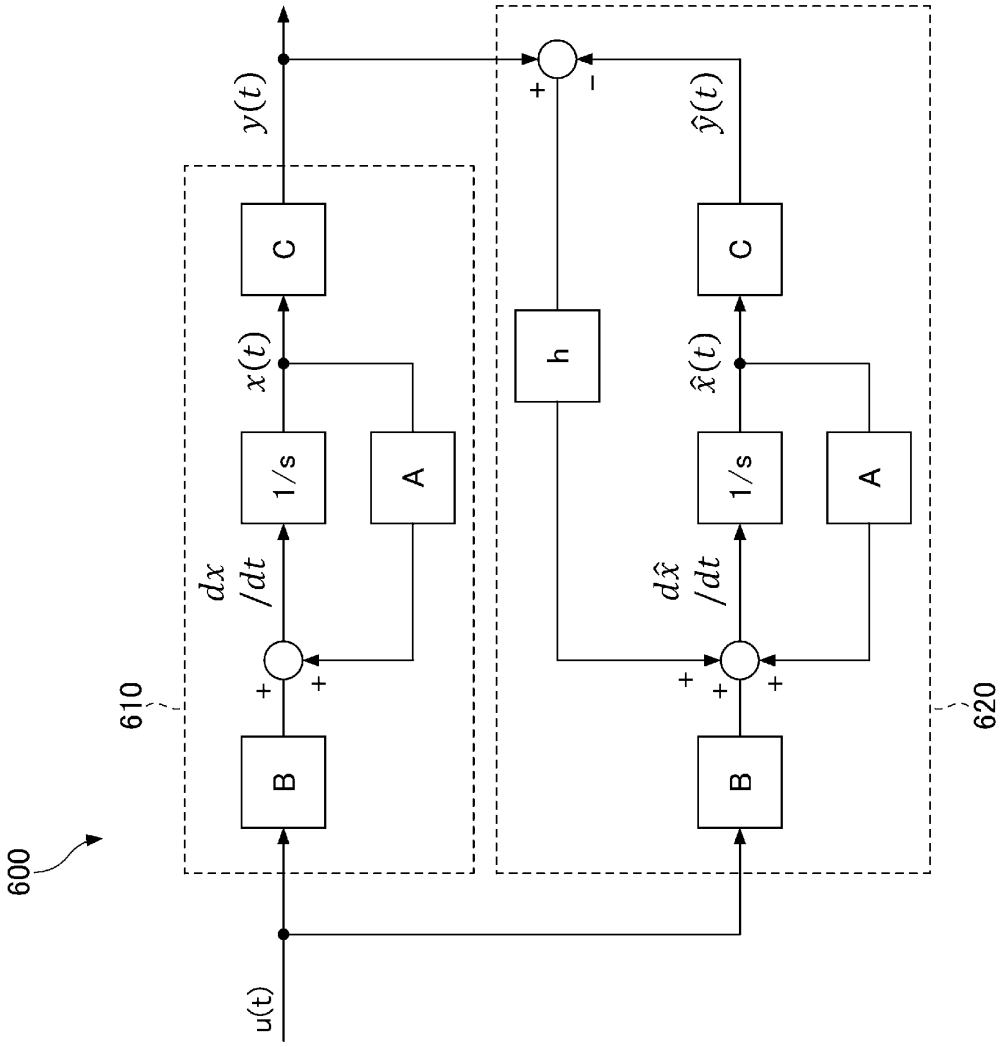
[図4]



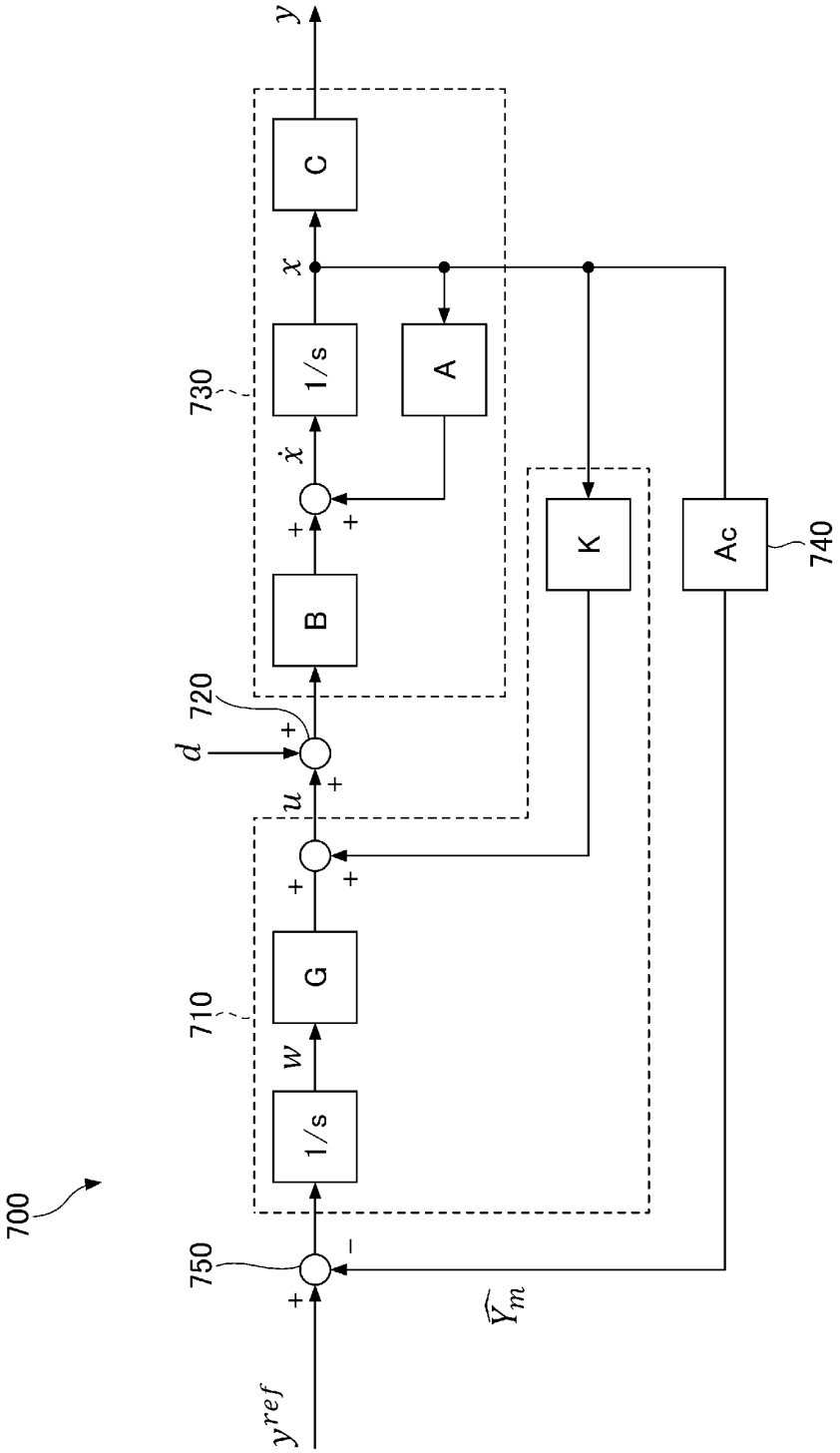
[図5]


Probe
Heat Flux
Chuck
Heat Flux
Ip
Ic
Rp
Rc
Cp
Cc
Tprob
Tchuck
Rdp
Rdc
Idp
Idc
Tj
Cd
Rd
Id
Die Heat
Flux

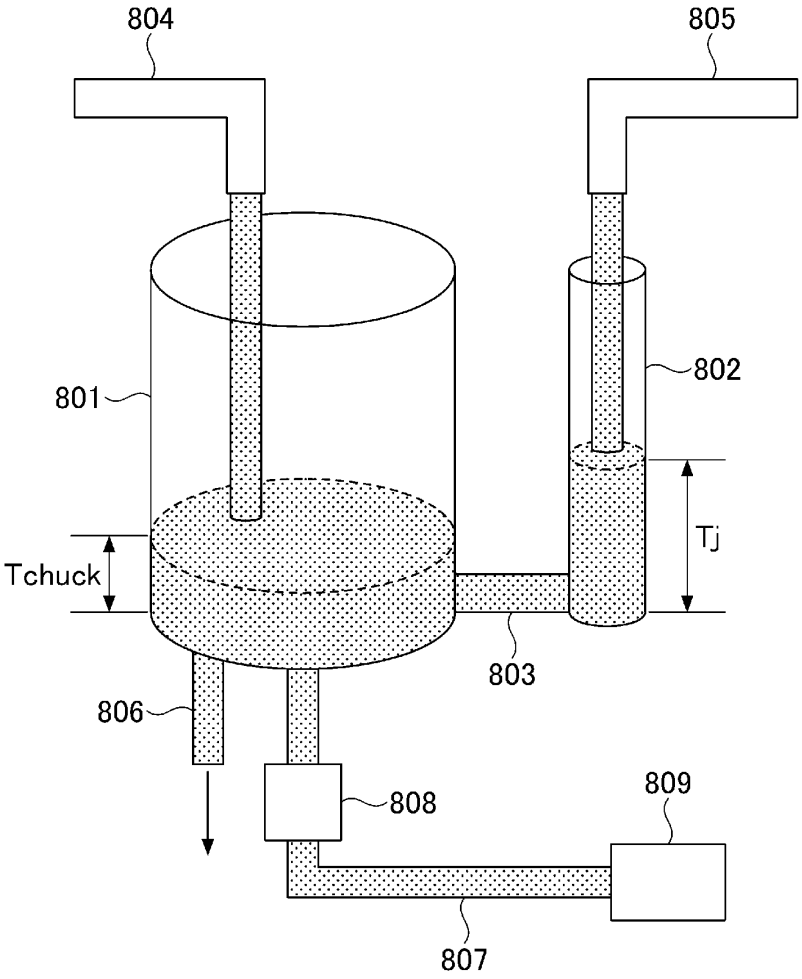
[図6]



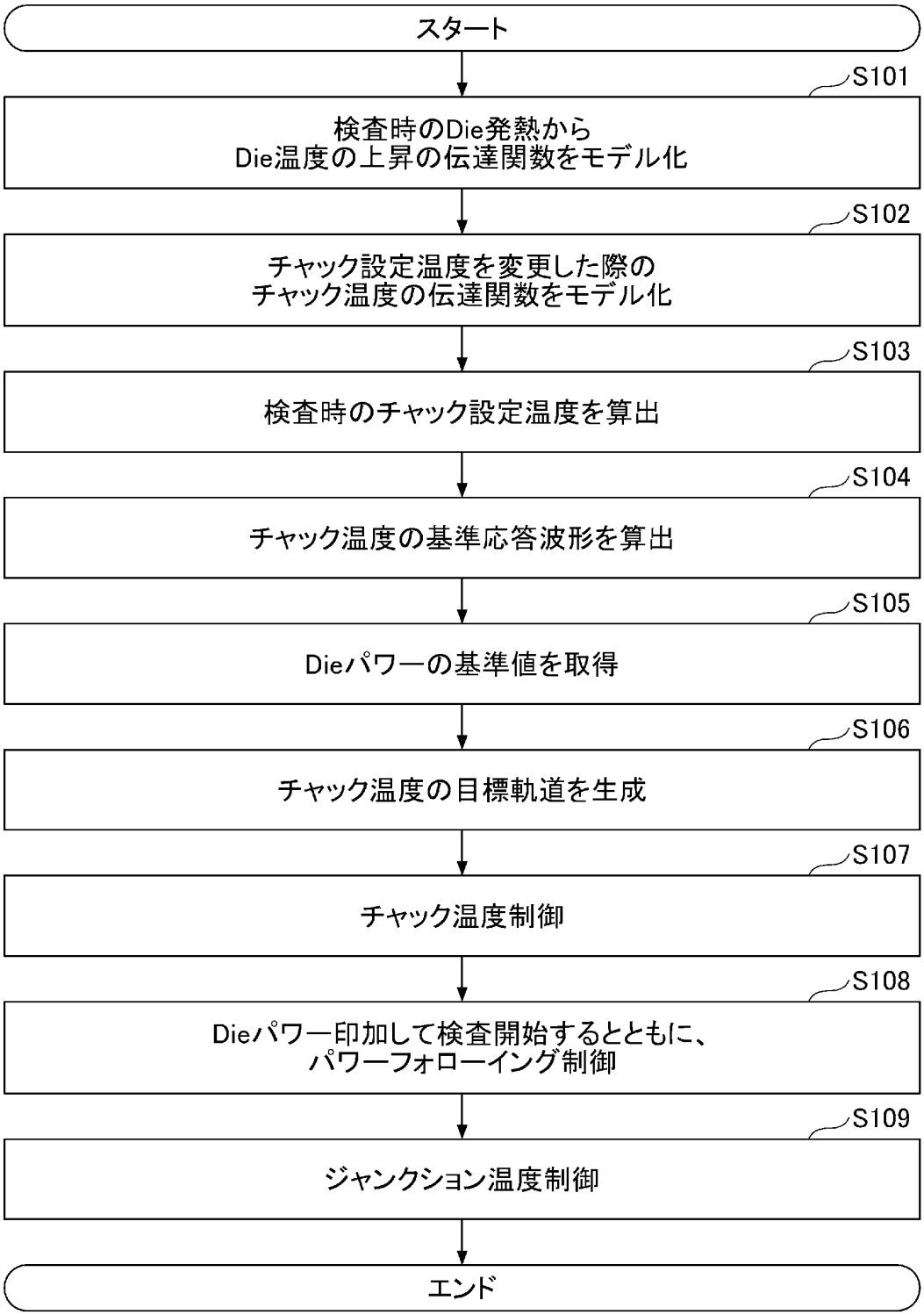
[図7]



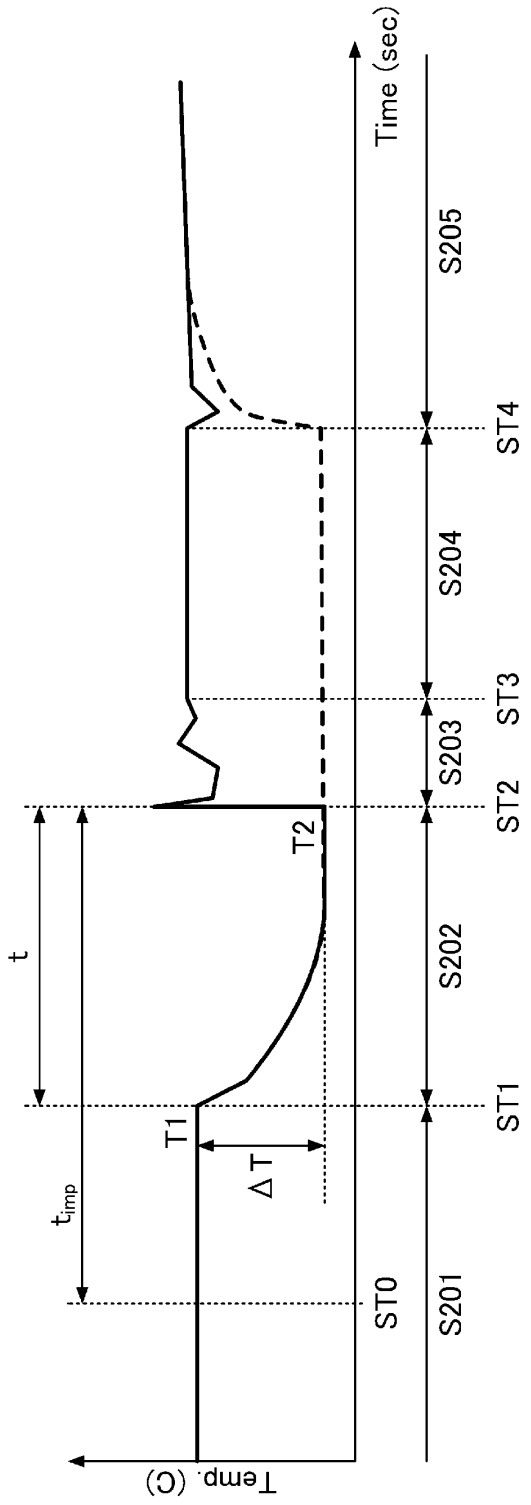
[図8]



[図9]


スタート
S101
検査時のDie発熱から
Die温度の上昇の伝達関数をモデル化
S102
チャック設定温度を変更した際の
チャック温度の伝達関数をモデル化
S103
検査時のチャック設定温度を算出
S104
チャック温度の基準応答波形を算出
S105
Dieパワーの基準値を取得
S106
チャック温度の目標軌道を生成
S107
チャック温度制御
S108
Dieパワー印加して検査開始するとともに、
パワーフォローイング制御
S109
ジャンクション温度制御
エンド

[図10]


Time (sec)
S205
S204
S203
S202
S201
ST4
ST3
ST2
ST1
ST0
T2
T1
ΔT
t
t_{imp}
Temp. (C)